

東京大学大学院 学生員 福島 伸二  
東京大学生産技術研究所 正員 龍田 文夫

1. まえがき

水じり単純せん断試験機(以下TSSAという)は垂直応力とせん断応力をそれぞれ独立に加えることのできるもので、より原位置に近い応力状態を再現できる試験機である。しかしこの試験機では供試体にせん断応力を加えるには供試体キャップとベースの摩擦により行うので、この摩擦により供試体上下端面付近の変形、拘束は避けられない。このためこの変形、拘束の影響を小さくするにはある程度以上の高さをもつ供試体を用いる必要があるものと考えらる。そこでこのTSSAを用いて、非排水せん断試験を行う供試体高さの有効応力経路、応力-ひずみ曲線に及ぼす影響を調べた。

2 実験方法

実験は供試体(Fig.2)の断面寸法(外径 $D_o=10\text{cm}$ 、内径 $d_i=6\text{cm}$ )は一定とし、高さ $h=2, 4, 10, 20\text{cm}$ と変えて非排水せん断試験を行う。供試体高さ $h$ が、その有効応力経路、応力-ひずみ曲線に及ぼす影響について調べた。試料は豊浦砂( $G_s=2.64, e_{max}=0.96, e_{min}=0.64$ )を使用し、供試体は乾燥状態のまま漏斗によりモールド内に自由落下(密度調節は漏斗からの砂の落下高さ $H$ により行う。密着めでは $H \geq 0\text{cm}$ 、密着めでは $H=40\text{cm}$ と $E$ )させて作製した。供試体作製後、供試体に二酸化炭素及び脱気水を通し、飽和させ、等方圧密後( $\sigma_a = \sigma_r = 1.0\text{kgf/cm}^2$ )非排水せん断試験を行う。この試験は供試体高さ $h$ のみ変化させ、その他の条件、つまり供試体キャップ、ベースの条件(不排水、スリットあり)、応力状態(等方圧密 $\sigma_a = \sigma_r$ 、中間主応力 $\sigma_2 = \sigma_r$  ( $b=0.5$ )), 主応力方向(回転して最大主応力方向は $\sigma_a$ 方向から $45^\circ$ 方向)、正規圧密、ひずみ速度( $\dot{\sigma}_{at} = 0.24\%/min$ )等の条件は全て同じにするようにした。尚、 $P = \frac{1}{3}(\sigma_a + \sigma_r + \sigma_t)$ である。

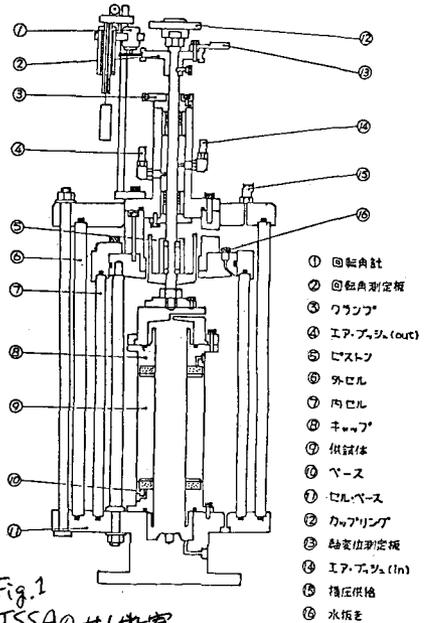
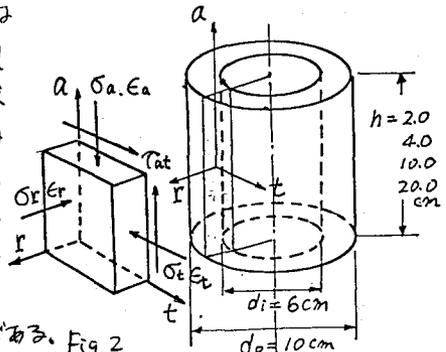


Fig. 1 TSSAのせん断室



供試体寸法と供試体に作用する応力

3. 実験結果

Fig. 3(a)には密着め砂に対する各供試体高さの有効応力経路と、Fig. 3(b)には密着め砂に対する各供試体高さの応力-ひずみ曲線を示してある。これらの図から、有効応力経路は $h=10\text{cm}$ と $20\text{cm}$ の差は小さいが、供試体高さ $h$ が小さいほどより密着め砂の挙動を示すことがわかる。これは供試体高さ $h$ が小さいほど供試体両端面の変形、拘束の影響が大きくなるため、供試体の変形は小さくなりせん断初期の負のダイラタンス性が小さくなるためと考えらる。また応力-ひずみ曲線も供試体高さ $h$ により著しく異なる。供試体高さ $h=2\text{cm}$ と $4\text{cm}$ の供試体では明確なピークを示すせん断応力は確認しづらく、次にFig. 4(a), (b)には密着め砂に対する各供試体高さの有効応力経路、応力-ひずみ曲線を示してある。これらの図から、密着め砂においても供

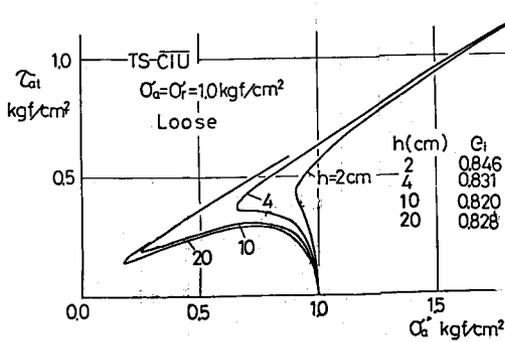


Fig. 3(a) 有効応力経路 (緩詰り砂)

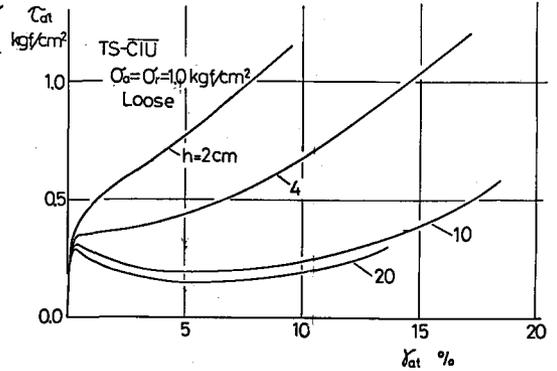


Fig. 3(b) 応力-ひずみ曲線 (緩詰り砂)

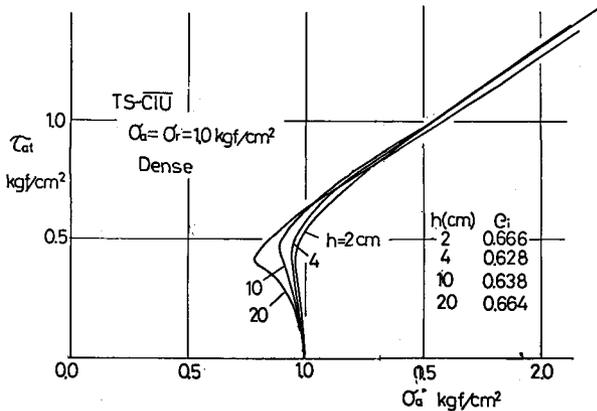


Fig. 4(a) 有効応力経路 (密詰り砂)

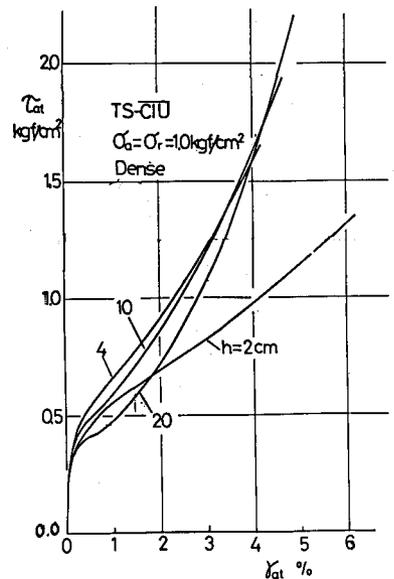


Fig. 4(b) 応力-ひずみ曲線 (密詰り砂)

試体高が小さいほどせん断初期の負のダイラタンシが小さく、有効応力経路、応力-ひずみ曲線共に供試体高により差があることがわかるが、二つらの差は緩詰り砂に比べて非常に小さい。また、Fig. 4(b)の応力-ひずみ曲線とみると、供試体高が小さいほど、 $\gamma_{at} = 4\%$ 付近における応力-ひずみ曲線の立ち上がりは小さいことがわかる。これは、供試体高が小さいほど変形が拘束されるため、正のダイラタンシが少なくなるため、つまり、負の空隙水圧により有効応力が増加することによるせん断応力の増加が小さく抑えられるためと思われる。また Fig. 3, 4を通じて言えることは供試体高が小さいほど有効応力経路、応力-ひずみ曲線が密度による差が小さい。このことを示しているのが次の Table 1 である。これは  $\gamma_{at} = 3\%$  における密詰り砂のせん断応力  $\tau_{at, Dense}$  と緩詰り砂のせん断応力  $\tau_{at, Loose}$  の比を各供試体高に対して求めたもので、この比は供試体高が小さいほど小さくなる。特に  $h = 10\text{cm}$  と  $20\text{cm}$  の差が小さい。

| $h$<br>(cm) | $\frac{\tau_{at, Dense}}{\tau_{at, Loose}}$ at $\gamma_{at} = 3\%$ |
|-------------|--|
| 2           | 1.32   |
| 4           | 3.21   |
| 10          | 6.20   |
| 20          | 6.29   |

Table 1.

#### 4. 結 論

供試体高が小さいと、供試体両端値の変形が拘束されるため、せん断中のダイラタンシの生じにくくなり、密度による有効応力経路、応力-ひずみ曲線の差が小さくなる。これは、供試体高は  $h = 10\text{cm}$  以上は必要である。